

部会	規格名称	番号	制定改正日
光受動部品	1 空間ビーム光用受動部品通則	JIS C 5860	改 2012/11/20
	空間ビーム光用受動部品通則(追補1)	JIS C 5860	改 * 2023/02/20
	2 干渉フィルタ通則	JIS C 5870	改 2009/03/20
	3 干渉フィルタ試験方法	JIS C 5871	改 2011/01/20
	空間ビーム光用光アイソレータ通則	JIS C 5872	廃 2006/11/20
	空間ビーム光用光アイソレータ試験方法	JIS C 5873	廃 2012/11/20
	4 位相子通則	JIS C 5876-1	制 2009/03/20
	5 偏光子-第1部:通則	JIS C 5877-1	改 2015/03/20
	6 偏光子試験方法	JIS C 5877-2	制 2012/01/20
	7 光伝送用受動部品通則	JIS C 5900	改 2019/10/21
	光伝送用受動部品試験方法	JIS C 5901	廃 2018/09/20
	光ブランピングデバイス通則(波長選択性のないもの)	JIS C 5910	廃 2014/03/20
	8 波長選択性のない光ブランピングデバイス-第1部:通則	JIS C 5910-1	改 2019/02/20
	波長選択性のない光ブランピングデバイス-第3部:シングルモード光ファイバビッグテール形1×N及び2×N光ブランピングデバイス	JIS C 5910-3	制 2015/03/20
	10 波長スイッチ通則	JIS C 5912	制 2006/03/25
	11 光サーキュレータ通則	JIS C 5914	改 2013/03/21
	12 光伝送用サーキュレータ-第3部:シングルモード光ファイバビッグテール形光サーキュレータ	JIS C 5914-3	制 2017/03/21
	シングルモード光ファイバビッグテール型光サーキュレータ	JIS C 5915	廃 2017/03/21
	13 光伝送用分散補償器通則	JIS C 5916	改 2012/05/21
	光伝送用分散補償器通則(追補1)	JIS C 5916	改 * 2023/02/20
	14 光ファイバ形分散補償器	JIS C 5916-3	制 2013/11/20
	15 光伝送用パワー制御受動部品-第1部:通則	JIS C 5920-1	制 2015/11/20
	16 光伝送用パワー制御受動部品-第3部:シングルモード光ファイバビッグテール形電気制御式可変光減衰器	JIS C 5920-3	制 2017/03/21
	17 光伝送用パワー制御受動部品-第4部:シングルモード光ファイバプラグレセプタクル形固定光減衰器	JIS C 5920-4	制 2019/07/22
	18 シングルモード光ファイバビッグテール型固定光減衰器	JIS C 5921	制 2009/12/21
	19 光伝送用WDMデバイス-第1部:通則	JIS C 5925-1	改 2016/03/22
	20 シングルモード光ファイバビッグテール形 C/Lバンド WDMデバイス	JIS C 5925-3	制 2011/01/20
	21 シングルモード光ファイバビッグテール形980/1 550 nmWWDMデバイス	JIS C 5925-4	制 2011/01/20
	22 光伝送用WDMデバイス-第5部:シングルモード光ファイバビッグテール形中規模1×N DWDMデバイス	JIS C 5925-5	改 2020/06/22
	23 光伝送用光フィルタ-第1部:通則	JIS C 5926-1	制 2014/03/20
	24 光伝送用スイッチ-第1部:通則	JIS C 5930-1	制 2016/03/22
	25 光伝送用スイッチ-第2部:試験方法	JIS C 5930-2	制 2019/03/20
	光スイッチ試験方法	JIS C 5931	廃 2019/03/20
	光アイソレータ通則	JIS C 5932	廃 2019/10/21
	26 光アイソレータ-第1部:通則	JIS C 5932-1	制 2019/10/21
	27 光アイソレータ-第2部:試験方法	JIS C 5932-2	制 2019/03/20
	28 光アイソレータ-第3部:シングルモード光ファイバビッグテール形光アイソレータ	JIS C 5932-3	制 2018/05/21
	光アイソレータ試験方法	JIS C 5933	廃 2019/03/20
	29 光伝送用レンズ通則	JIS C 5934	制 1999/07/20
	30 光伝送用レンズ試験方法	JIS C 5935	制 2005/01/20
	シングルモード光ファイバビッグテール形光アイソレータ	JIS C 5936-3	廃 2018/05/21
31 光ファイバ接続デバイス及び光受動部品-基本試験及び測定手順-第1部:通則	JIS C 61300-1	改 2019/06/20	
32 光ファイバ接続デバイス及び光受動部品-基本試験及び測定手順-第2-1部:正弦波振動試験	JIS C 61300-2-1	制 2012/11/20	
33 光ファイバ接続デバイス及び光受動部品-基本試験及び測定手順-第2-9部:衝撃試験	JIS C 61300-2-9	制 2012/11/20	
34 光ファイバ接続デバイス及び光受動部品-基本試験及び測定手順-第2-12部:落下衝撃試験	JIS C 61300-2-12	制 2011/01/20	
35 光ファイバ接続デバイス及び光受動部品-基本試験及び測定手順-第2-14部:高光パワー試験	JIS C 61300-2-14	改 2020/02/20	
36 光ファイバ接続デバイス及び光受動部品-基本試験及び測定手順-第2-17部:低温試験	JIS C 61300-2-17	改 2020/11/20	
37 光ファイバ接続デバイス及び光受動部品-基本試験及び測定手順-第2-18部:高温試験	JIS C 61300-2-18	制 2009/07/20	
38 光ファイバ接続デバイス及び光受動部品-基本試験及び測定手順-第2-19部:高温高湿試験-定常状態	JIS C 61300-2-19	改 2020/11/20	
39 光ファイバ接続デバイス及び光受動部品-基本試験及び測定手順-第2-21部:混合温湿度サイクル試験	JIS C 61300-2-21	制 2012/11/20	
40 光ファイバ接続デバイス及び光受動部品-基本試験及び測定手順-第2-22部:温度サイクル試験	JIS C 61300-2-22	制 2012/01/20	
41 光ファイバ接続デバイス及び光受動部品-基本試験及び測定手順-第2-26部:塩水噴霧試験	JIS C 61300-2-26	制 2013/03/21	

部会	規格名称	番号	制定改正日
42	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－ 基本試験及び測定手順－第2-45部:浸水試験	JIS C 61300-2-45	制 2009/07/20
43	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－ 基本試験及び測定手順－第2-46部:試験－湿熱サイクル	JIS C 61300-2-46	改 2021/09/21
44	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－ 基本試験及び測定手順－第2-47部:熱衝撃試験	JIS C 61300-2-47	制 2012/01/20
45	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－ 基本試験及び測定手順－第2-48部:温湿度サイクル試験	JIS C 61300-2-48	制 2010/03/23
46	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－ 基本試験及び測定手順－第3-2部:シングルモード光デバイスの 光損失の偏光依存性	JIS C 61300-3-2	制 2012/01/20
47	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－ 基本試験及び測定手順－第3-3部:挿入損失及び反射減衰量変 化のモニタ方法	JIS C 61300-3-3	制 2009/07/20
48	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－ 基本試験及び測定手順－第3-6部:反射減衰量測定	JIS C 61300-3-6	制 2011/01/20
49	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－ 基本試験及び測定手順－第3-7部:シングルモード光部品の光 損失及び反射減衰量の波長依存性測定	JIS C 61300-3-7	制 2012/11/20
50	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－ 基本試験及び測定手順－第3-14部:可変光減衰器の減衰量の 設定の誤差及び再現性測定	JIS C 61300-3-14	制 2016/06/20
51	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－ 基本試験及び測定手順－第3-20部:波長選択性のない光ブラン ディングデバイスのディレクティビティ測定	JIS C 61300-3-20	制 2009/07/20
52	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－ 基本試験及び測定手順－第3-21部:切替時間測定	JIS C 61300-3-21	制 2016/03/22
53	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－ 基本試験及び測定手順－第3-28部:過渡損失測定	JIS C 61300-3-28	改 2020/09/23
	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－ 基本試験及び測定手順－第3-31部:光ファイバ光源の結合パ ワー比測定	JIS C 61300-3-31	廃 2018/09/20
54	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－ 基本試験及び測定手順－第3-32部:光受動部品の偏波モード分 散測定	JIS C 61300-3-32	制 2013/03/21
55	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－ 基本試験及び測定手順－第3-38部:群遅延, 波長分散及び位 相リップル測定	JIS C 61300-3-38	制 2015/11/20
56	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－ 基本試験及び測定手順－第3-43部:光ファイバ光源のモードトラ ンスファクション測定	JIS C 61300-3-43	制 2012/11/20
57	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－ 基本試験及び測定手順－第3-50部:光スイッチのクロストーク測 定	JIS C 61300-3-50	制 2016/03/22
58	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－基本試験及び測定手 順－第3-53部:検査及び測定－マルチモード導波路(光ファイ バを含む)からの2次元ファーフールドデータに基づくエンサー クルドアンギュラーフラックス(EAF)測定方法	JIS C 61300-3-53	制 * 2022/09/20

(注)制:制定年月日, 改:改正年月日, 廃:廃止年月日を示す